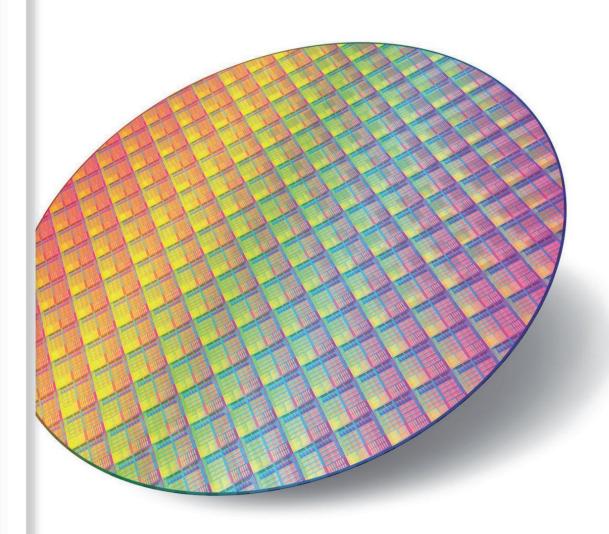
Distribution DOW Product





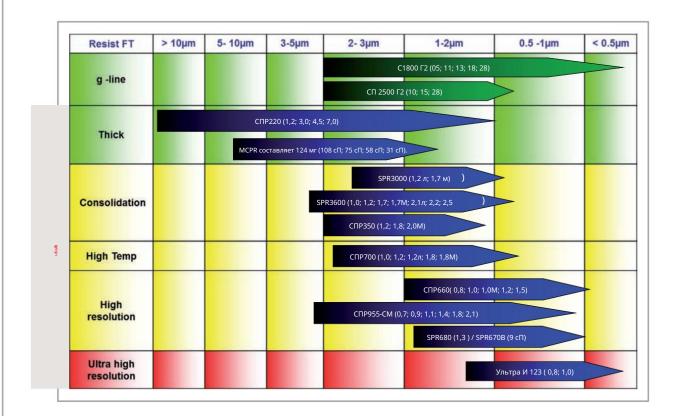
g-line • i-line • DUV — резисты Материалы BARC

Сопротивление отрыву

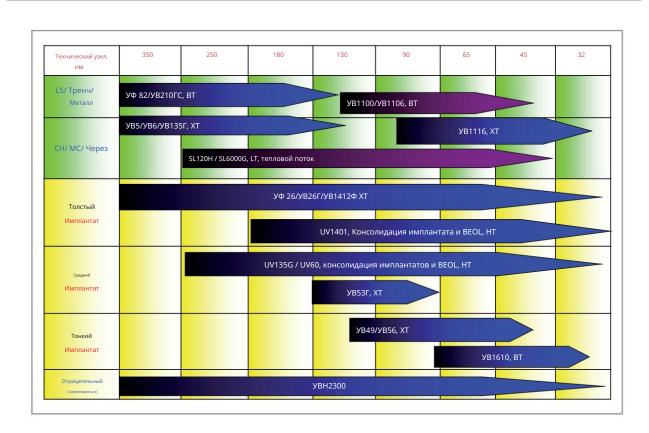


Страница З	RHEM • Продукты g-Line, i-Line и DUV Обзор	
Страница 4	RHEM • Продукты g-Line и i-Line Серия Resist S1800 G2	• Позитивное сопротивление
Страница 5	RHEM • Продукты i-Line Резист серии SPR220	• Позитивное сопротивление
	T COVET CEPTINI ST 10220	To shirt the composition of the
Страница 6	Resist Series SPR220 (толстое нанесение)	• Позитивное сопротивление
Страница 7	Серия Resist SPR3012/3510/3600	• Позитивное сопротивление
Страница 8	Резист серии SPR700	• Позитивное сопротивление
Страница 9	Резист серии SPR660	• Позитивное сопротивление
Страница 10	Серия резистов SPR955-CM	• Позитивное сопротивление
Страница 11	Серия Resist Ультра- я ™123	• Позитивное сопротивление
Страница 12	RHEM • Сопротивление отрыву МИКРОПОЗИТ ЛОЛ1000/ 2000	• Для двухслойных процессов отрыва
	PEM • FSC Покрытие передней поверхности	• Защитное покрытие поверхности
Страница 13	RHEM • Продукция DUV Серия резистов UV26/UV26G	• Позитивное сопротивление
Страница 14	Резист серии UV60	• Позитивное сопротивление
Страница 15	Резист серии UV1100	• Позитивное сопротивление
Страница 16	Серия Resist UV210GS	• Позитивное сопротивление
Страница 17	Резист серии UVN2300	• Негативное сопротивление
Страница 18	БАРК • Вспомогательное оборудование	
	и разработчики	
Страница 19	BARC • Вспомогательное оборудование AR602	
	Проявляющееся антибликовое вещество	
Страница 20	Расширенные средства удаления • Вспомогательные средства	97 50
	Хромовый травитель 18	

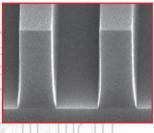
RHEM • Продукты g-Line и i-Line – обзор и толщина пленки



RHEM • Продукты DUV – обзор и технический узел



Сопротивляться	C1828 G2	C1818 G2 (СП16)	C1813 G2 (CΠ15)	C1811 G2	C1805 G2
Толщина пленки при 4000 об/м	ин 2,8 мкм	1,8 мкм	1,3 мкм	1,1 мкм	0,5 мкм
Вязкость/сСт	88,5	39,4	25	15	5.3
Доза (широкополосное соединение)	300 мДж	200 мДж	160 мДж	140 мДж	100 мДж



1.20 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 Exposed

300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500

Wavelength (nm)

Кривая поглощения S1800G2

4 мкм Ft/ 2 мкм L/S 310 мДж

1,3 мкм Ft/ 0,8 мкм L/S 180 мДж

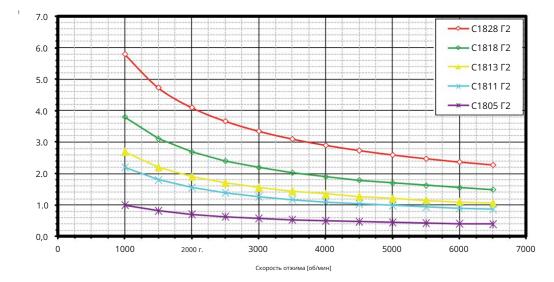
С1800Г2

Для микролитографии

Фоторезист серии MICROPOSIT \$1800 G2 — это системы позитивного фоторезиста, разработанные для удовлетворения требований микроэлектронной промышленности к производству интегральных схем.

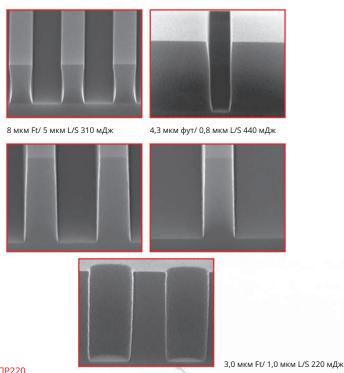
Система была разработана с использованием токсикологически более безопасного растворителя для литья, альтернативного эфирным ацетатам, полученным из этиленгликоля.

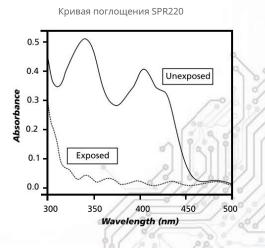
- Оптимизирован для воздействия на линии G и і.
- Эффективен для широкополосного доступа
- Отличная адгезия (улучшенная с помощью SP)
- ПФОС/ПФОК бесплатно
- Оптимизирован для использования с MF-319.
 семейство проявителей, не содержащих ионов металлов
- Совместим с металлоионосодержащими Разработчики



Резист серии SPR220

Сопротивляться	СПР220-7,0	СПР220-4,5	СПР220-3,0	СПР220-1,2
Толщина пленки при 3000 об/м	ин 7,0 мкм	4,5 мкм	3,0 мкм	1,2 мкм
Вязкость/сСт	390	123	49	11,5
Доза (і-линия)	470 мДж	380 мДж	310 мДж	160 мДж





СПР220

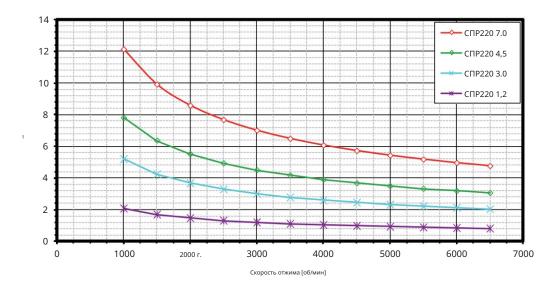
Для микролитографии

Фоторезист MEGAPOSIT SPR220 i-line — это

оптимизированный многоволновой резист общего назначения, предназначенный для покрытия широкого диапазона толщин пленок (1-30 мкм) при нанесении в один слой.

Фоторезист MEGAPOSIT SPR220 также имеет отличные характеристики адгезии и покрытия, что делает его идеальным для такой толстой пленки. приложения, такие как MEMS и ударный процесс.

- Поддержка широкополосного доступа в Интернет, G-Line и i-Line.
- Толщина пленки >10 мкм в один слой с хорошей однородностью
- Отличная адгезия при влажном и сухом травлении.
- Золото; Покрытие Cu и Ni/Fe без
- Совместимость с разработчиками MIF и MIB



Серия Resist SPR220 – Толстое нанесение

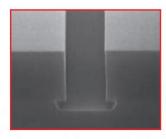
Рекомендуемые условия процесса				
	Толщина от 1,1 до 4,0 мкм*	Толщина от 1,1 до 10,0 мкм*		
Толщина:	1,1–4,0 мкм	1,1–10,0 мкм	*	
Мягкая выпечка:	115°C/ 90 сек. Контактная плита	30 сек. снизить температуру до 115°C/90 сек. Контактная плита	^	
Разоблачать:	ASML PAS 5500/ 200 i-Line (0,48 NA, 0,50 σ)	ASML PAS 5500/ 200 i-Line (0,48 NA, 0,50 σ)		
УИБ:	115°C/ 90 сек. Контактная плита	115°C/ 90 сек. Контактная плита		
Разработчик:	МҒ™- 24 А при 21°С, 60 сек.	МF™- 24 А при 21°С, 60 сек.		
	одиночная лужа распыления	одиночная лужа распыления		

* Рекомендуется также для изолированных помещений.

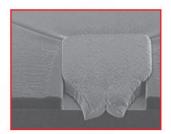
Дополнительную информацию см. в техническом описании.



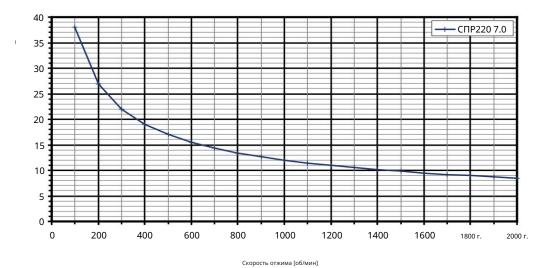
Протравка траншей (процесс Bos Особенности от 4 до 10 мкм (глубина до 100 мкм)



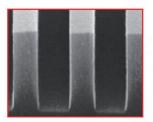
Влажное травление пластин (1:5 HF 5 мин 2 мкм особенности



Верхняя пластина SPR220 40 мкм с Au



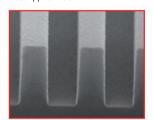
Сопротивляться	SPR3625	SPR3621 (Л)	SPR3617 (M)	SPR3612	SPR3012 (Л)	СПР3510
Толщина пленки при 3000 об/м	ин 2,5 мкм	2,2 мкм	1,7 мкм	1,2 мкм	1,18 мкм 0,94 м	км
Вязкость/сСт	59,7	45,3	31,5	18,3	24,3	14
Доза (і-линия)	140 мДж	110 мДж	150 мДж (М) 90 мДж	80 мДж	200 мДж	110 мДж



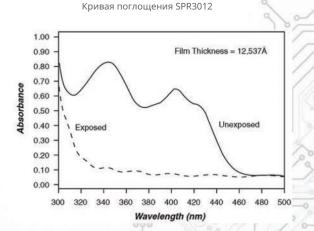
1,07 MKM FT / 600 MKM L/S 85 мДж SPR3612



1,75 MKM FT / 600 HM L/S 155 мДж SPR3617M



1,07 мкм FT / 500 нм L/S . 105 мДж SPR3510



CПР 3012/3510/3600

1,17 мкм FT / 700 нм L/S

204 мДж SPR3012

Для микролитографии

МЕГАПОЗИТ SPR3012/ 3510/3600

Серия Photoresist — это позитивный фоторезист, разработанный для приложений i-line, g-line и широкополосной печати, обеспечивающий высокую производительность и превосходные литографические характеристиMF, ГАПОЗИТ СПР 3510 :

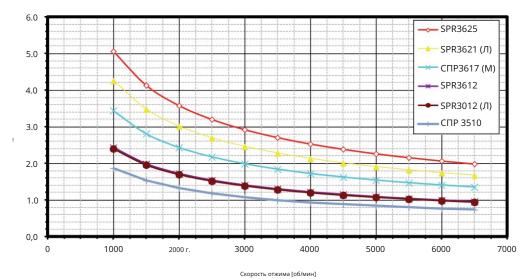
Преимущества

МЕГАПОЗИТ СПР 3012:

- отличная адгезия
- Версия с L-окрашиванием для улучшенного контроля компакт-диска над топографией.
- высокая термостойкость/стойкость к травлению
- высокопроизводительный процесс

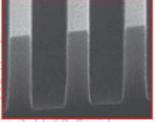
МЕГАПОЗИТ СПР 3600:

- чрезвычайно высокопроизводительный процесс
- высокая термостойкость/стойкость к травлению
- окрашенная версия для улучшения контроля CD над топографией.



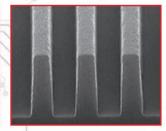
Резист серии SPR700

Сопротивляться	SPR700- 1,8 млн.	SPR700- 1,8	SPR700- 1,2 л	SPR700- 1.2	SPR700- 1.0
Толщина пленки при 4000 об/м	ин 1,8 мкм	1,8 мкм	1,2 мкм	1,2 мкм	1,0 мкм
Вязкость/сСт	35,1	35,1	18,3	18,3	14.1
Доза (і-линия)	270 мДж	190 мДж	160 мДж	140 мДж	130 мДж



1,8 мкм FT/ 0,6 мкм L/S 270 мДж

2,2 мкм FT/ 0,6 мкм L/S 197 мДж



1.20 0.80 0.70 Refractive Index 0.60 Unexposed 0.50 0.40 0.30 Exposed 0.20 0.10 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500

Кривая поглощения SPR700

1,2 мкм FT/ 0,5 мкм L/S 134 мДж

0,968 мкм FT/ 350 нм L/S 135 мДж

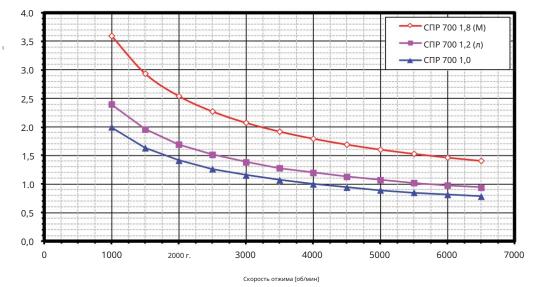
СПР700

Для микролитографии

Фоторезисты серии MEGAPOSIT SPR700 представляют собой позитивные многоволновые фоторезисты, оптимизированные для обеспечения надежных технологических широт и высокой производительности с превосходной термической стабильностью. Резисты SPR700 совместимы с широким спектром

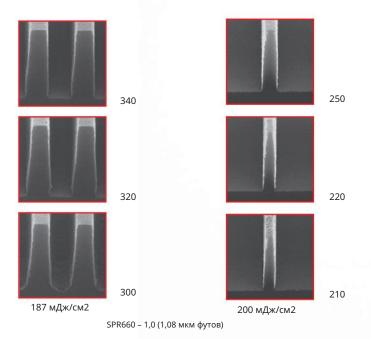
семейств проявителей. Эта универсальность делает фоторезисты SPR700 идеальными для ряда применений, особенно для смешанной литографии.

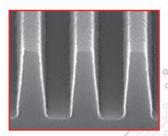
- Многоволновая связь (і-линия, д-линия и широкополосная связь)
- Совместимость с широким спектром разработчиков. семьи (0,26H,0,24H, 0,21H)
- Отличные технологические возможности и надежность процесса
- Термическая стабильность больше или равна 135°C
- Высокая производительность шагового двигателя и проявителя процесс



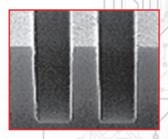
Резист серии SPR660

Сопротивляться	СПР660-1,5 СПР660-1,2 СПР660-1,0 СПР660-1,0М СПР660-0,8				
Толщина пленки при 3200 об/м	ин 1,5 мкм	1,2 мкм	1,0 мкм	1,0 мкм	0,8 мкм
Вязкость/сСт	17,6	13.06	10.4	10.4	8
Доза (і-линия)	250 мДж	210 мДж	170 мДж	205 мДж	150 мДж





SPR660 1,0M, 0,977 мкм FT/ 0,35 мкм Л/С, 202 мДж



0,97 мкм FT/ 350 нм L/S, 163 мДж

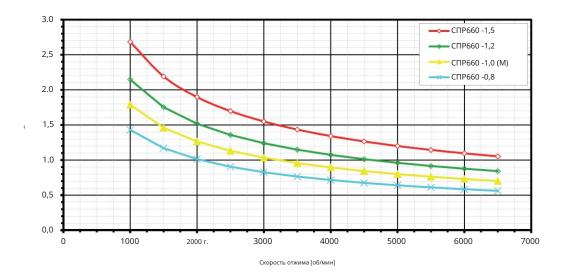
СПР660

Для микролитографии

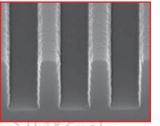
Серия SPR660 — это усовершенствованный фоторезист

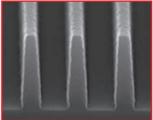
i-line, предназначенный для обработки деталей размером 0,350 микрон и больше. SPR660 работает как при нанесении на линии/пространство, так и на контактных отверстиях, а также на различных подложках, включая диоксид кремния, нитрид титана и органические антибликовые покрытия. Семейство продуктов SPR660 включает ряд неокрашенных разбавлений, а также красителей для улучшения обработки отражающей поверхности.

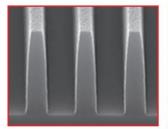
- Линейное разрешение
- 0,325 мкм над кремниевой подложкой
- < 0,300 мкм над антибликовым покрытием
- Широкие возможности процесса
 - DoF 1,5 мкм для линий/пробелов 0,4 мкм
 - DoF 1,2 мкм для контактных отверстий 0,4 мкм
- Совместим с проявителем 0,24N и 0,26N.
- Срок годности 12 месяцев.

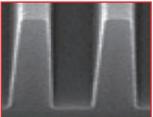


Сопротивляться	SPR955- CM-2.1	SPR955- CM-1,8	SPR955- CM-1.4	SPR955- CM-1.1	SPR955- CM-0,9	SPR955- CM-0,7
Толщина пленки при 3000 об/мин	2,1 мкм	1,8 мкм	1,4 мкм	1,1 мкм	0,9 мкм	0,7 мкм
Вязкость/сСт 34,3		28,6	19	14.3	11,2 мкм	8,5
Доза (і-линия)	238 мДж	210 мДж	197 мДж	173 мДж	165 мДж	157 мДж







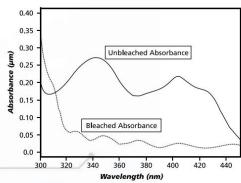


0,76 мкм FT/ 350 нм L/S 160 мДж 1,08 мкм FT/ 280 нм L/S 170 мДж 1,5 мкм FT/ 0,4 мкм L/S 197 мДж

1,8 мкм FT/ 450 нм L/S 205 мДж

5,0 мкм FT/ 0,8 мкм L/S 800 мДж

Кривая поглощения SPR955-CM



SPR955-CM

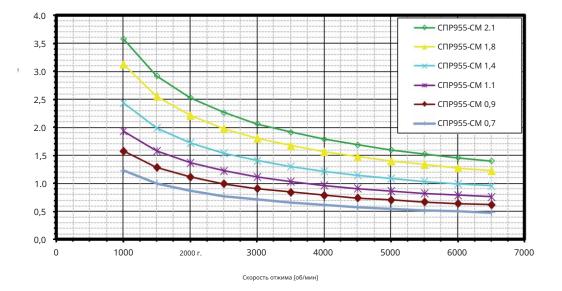
Для микролитографии

Фоторезист серии MEGAPOSIT SPR955-СМ представляет собой высокопроизводительный фоторезист общего назначения i-line для толщины 0,35 мкм. интерфейсные и серверные приложения. SPR955-СМ оптимизирован для антибликового (органического и неорганического) покрытия.

Преимущества

Правила проектирования 350 нм

- Плотные линии/пробелы и изолированные линии на поликремний
- Плотные линии/пространства в фильме с высоким соотношением сторон. на ТиН
- Контактные отверстия на оксиде
- Изолированные помещения (траншеи)



Серия Resist Ультра- Я™123 – Высокое разрешение < 0,25 мкм выбор резистов i-Line

Сопротивляться	Ультра-я ™123-1,0	Ультра-я ™123-0,8
Толщина пленки при 2500 об/м	ин 1,0 мкм	0,8 мкм
Вязкость/сСт	8,6	6.6
Доза (і-линия)	295 мДж	250 мДж

230 нм 1:1,5 л/с

225 мДж/см2





235 мДж/см2

ARL: 1,500 Å XHRi над Si ФУТ: 7,620 Å ОПЫТ: 0,60 NA, 0,75σ Контактное отверстие 300 нм 1,1



535 мДж/см2 FT: 8,650 Å над BPSG ОПЫТ: 0,57 NA, 0,85σ

Пластина 250 нм, маска 350 нм



345 мДж/см2 FT: 7,480 Å над BPSG ОПЫТ: 0,57 NA, 0,85σ

Ультрая™123

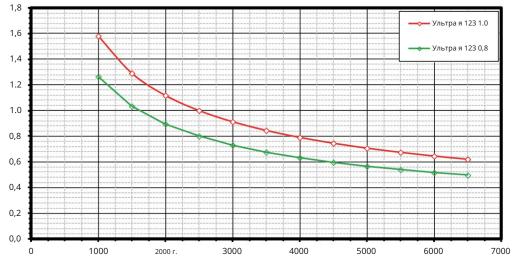
Для микролитографии

Ultra-ти12 — это усовершенствованный фоторезист общего назначения с критической толщиной i-line толщиной 0,25 мкм и возможностью расширения до 0,23 мкм и ниже. Ultra-™¶ 23 оптимизирован для антибликового покрытия.

Преимущества

Линии/Пробелы

- Степень резкости 1,0 мкм при плотности 0,25 мкм
- Степень резкости 1,1 мкм при полуплотной толщине 0,23 мкм Контактные отверстия
- 1,1 мкм DoF при 0,30 мкм CH
- 1,1 мкм при CH 0,25 мм (с PSM)



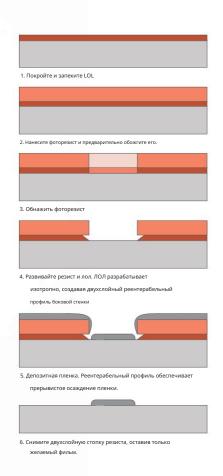
Скорость отжима [об/мин]

Для двухслойных процессов отрыва

Отрывной слой Microposit LOL 1000/2000 представляет собой окрашенный раствор PMGI (полиметилглутаримида) с повышенной скоростью растворения, используемый в процессах отрыва, требующих жесткого контроля CD, таких как тонкопленочная головка GMR, GaAs и другие передовые полупроводниковые материалы. Приложения. Двухслойный старт LOL Этот процесс подходит для применений, где тонкий слой металла напыляется или испаряется в аддитивном процессе. Изменение CD из-за смещения травления, свойственного субстрективным процессам, устраняется, что приводит к превосходному контролю ширины линии металла. Исключается воздействие на подложки травителя.



LOL 2000 на Si при 200 °C/5 мин. с 5,0 микронами SPR950

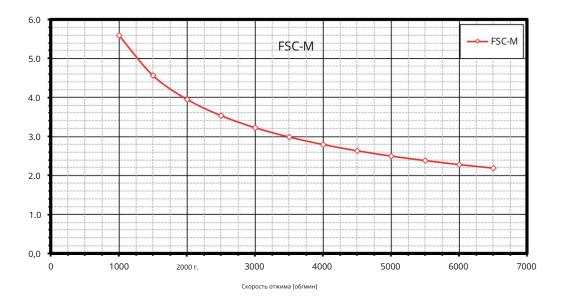


MICROPOSIT FSC – ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ

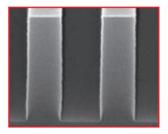
Поверхностное покрытие серии MICROPOSIT FSC представляет собой неотображаемое покрытие, созданное в качестве защитного покрытия для использования во время химических или механических процессов в производстве микроэлектроники. В состав системы входит один растворитель. Он не содержит ксилола, ацетона или ацетата целлозольва.

Поверхностное покрытие серии Microposit FSC доступно в двух диапазонах толщины.

•FSC-M: от 2,4 до 3,3 мкм. Для защиты передней части спины притирка, фильтрация 0,2 мкм

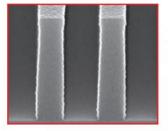


Сопротивляться	УФ26 3.0	УФ26 2,5	УФ26 2.0	УФ26 1,35	УФ26 0,7	УВ26Г 1,6	УВ26Г 1.3
Толщина пленки при 30	000 об/мин	3,0 мкм 2,5	мкм 2,0 мі	км 1,35 мкм	1 0,7 мкм 1,	6 мкм 1,3 м	IKM
Вязкость/сСт	112	80	58,4	33	12,5	44	31,3
Доза (средняя для L/S)	30 мДж	27 мДж	25 мДж	20 мДж	15 мДж	22 мДж	20 мДж



2,5 мкм Фт / 800 нм L/S 25 мДж

1,8 мкм Фт / 600 нм L/S 21 мДж



1,4 мкм Фт / 380 нм L/S 19 мДж

Кривая поглощения UV26 2.0 1.5 0.0 225 250 275 300 325 350 375 Wavelength (nanometers)

УВ26/УВ26Г

Описание

UV26 — это позитивный фоторезист DUV, разработанный для глубоких имплантатов .

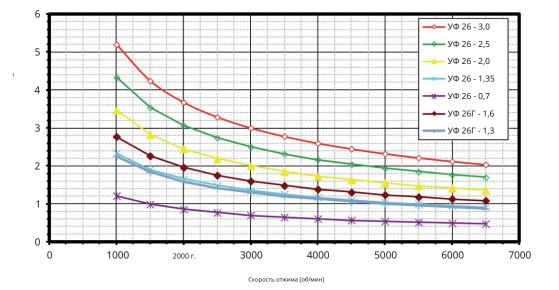
Низкая вязкость UV26 позволяет уменьшить объем дозирования и улучшить покрытие.

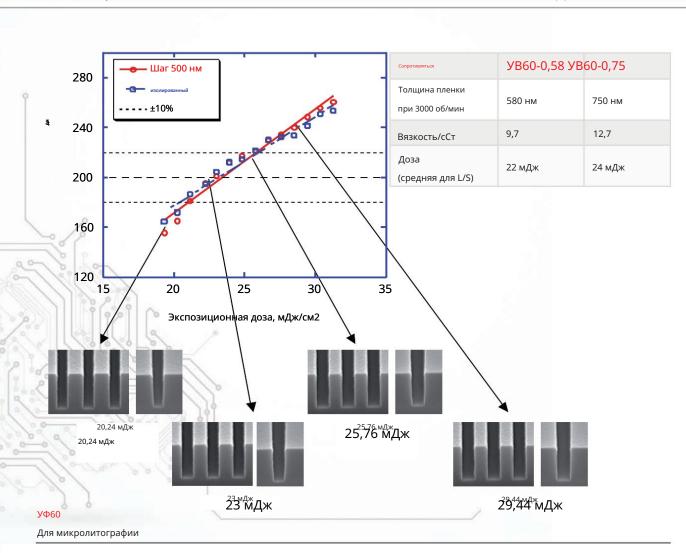
Однородность для пленки размером от 0,7 мкм до 3,0 мкм. UV26G — долгосрочная «зеленая» замена UV26.

Функции

Определение параметров энергии DoF Разрешения

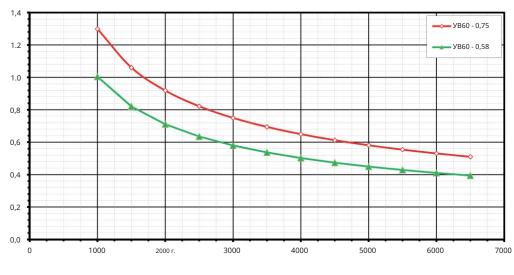
- 16,5 мДж/см2 для 350 нм, соотношение линий/промежутков 1:1 при 1,1 мкм FT 0,80 мкм DoF Разрешение 240 нм
- 18,5 мДж/см2 для траншей 450 нм 1:1 при 1,8 мкм FT 1,35 мкм DoF Разрешение 280 нм
- 20,5 мДж/см2 для 600 нм, соотношение линий/промежутков 1:1 при 2,5 мкм FT 1,0 мкм DoF Разрешение 500 нм



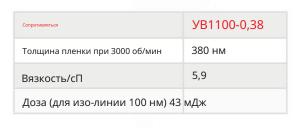


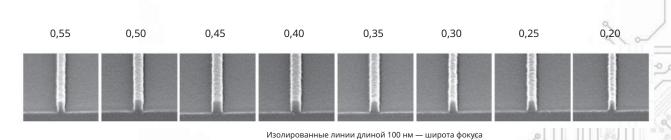
UV60 — это позитивный фоторезист DUV, предназначенный для консолидации имплантатов, металлических контактных отверстий и сквозных применений для функций 200 нм. UV60 хорошо работает на отражающих подложках.

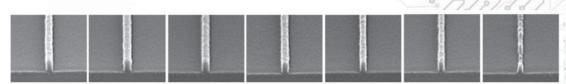
- Степень резкости > 0,5 мкм для траншей 200 нм 1:1,25
- Превосходное разрешение
- Хорошая широта экспозиции.
- Вертикальные профили



Дефокус, мкм







Изолированные линии длиной 80 нм — широта фокуса

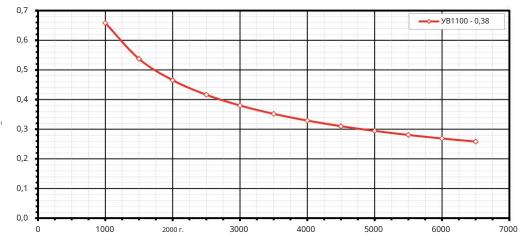
УВ1100

Описание

UV1100 — это высокотемпературный положительный DUV- устойчивый материал. UV1100 отличается

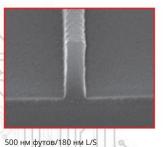
превосходным разрешением и широким технологическим окном для обработки металлов и траншей. UV1100 хорошо работает с органическим антибликом для процессов нанесения твердых масок и особенно подходит для нанесения в металлических траншеях.

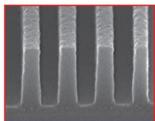
- Низкое смещение по высоте тона
- Отличная стойкость к травлению.
- Минимальная чувствительность SB/PEB
- Хорошее окно процесса
- Хорошее разрешение



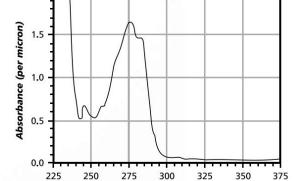
Скорость отжима [об/мин]

Сопротивляться	УВ210ГС-0,6	УВ210ГС-0,4	УВ210ГС-0,3
Толщина пленки при 2750 об/к	иин 600 нм	400 нм	300 нм
Вязкость/сСт	13.83	10.07	7.52
Доза (средняя для L/S)	30 мДж	28 мДж	26 мДж



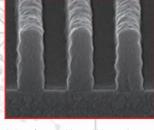


500 нм футов/180 нм L/S



Wavelength (nm)

Кривая поглощения UV210GS



315 нм футов/ 130 нм/ 220 нм L/S

УВ210ГС

Для микролитографии

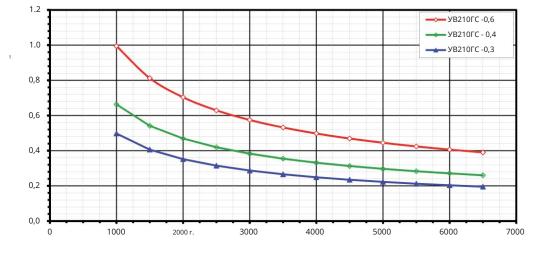
UV210GS — это многоцелевой резист, который можно использовать для затворов, контактных отверстий маски фазового сдвига и траншей в диапазоне CD 180–130 нм.

Функции

2.0

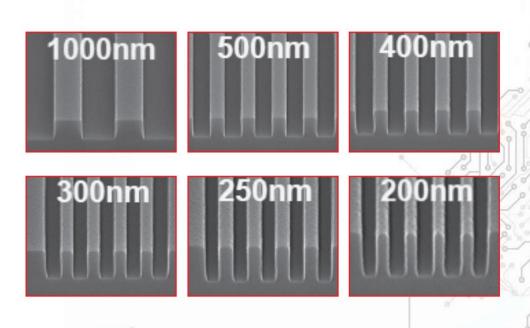
- 28 мДж/см2 для 130 нм 1:1,5 строк/промежутков 1,0 мкм Разрешение 130 нм
- 33 мДж/см2 для траншей 180 нм 1:1
 - 0,8 мкм Разрешение 160 нм
- 60 мДж/см2 для контактных отверстий 180 нм 1:1

Глубина резкости 0,7 мкм Разрешение 150 нм (смещение 70 нм)



Скорость отжима [об/мин]

Сопротивляться	УВН2300-0,4	УВН2300-0,5	УВН2300-0,8
Толщина пленки при 3200 об/мин	400 нм	500 нм	800 нм
Вязкость/сСт	3,85	4,77	8.07
Доза (средняя для L/S)	18 мДж	20 мДж	40 мДж



УВН2300

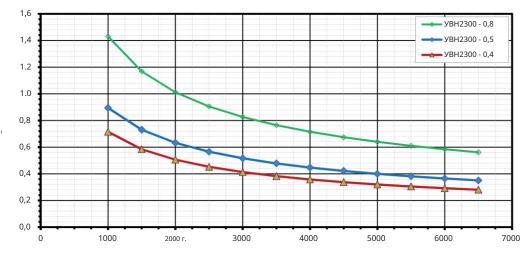
Описание

UVN2300 — это негативный фоторезист, не содержащий ПФОС, для применения в DUV. Этот резист предназначен для производства устройств с высокой производительностью до 150 нм. Вложенные строки/ пробелы, изолированные строки, сообщения и контакты можно разрешить с помощью широких окон обработки. Минимальная чувствительность к РЕВ, нечувствительность к переносимым по воздуху загрязнениям и превосходная стойкость к травлению металла — это лишь некоторые из свойств, которые предлагает UVN2300.

Функции

Определение параметров энергии

- 10,0 100 мДж для линий и пробелов Глубина фокуса
- Степень резкости 1,3 мкм для полутраншейных волн 300 нм
- Степень резкости 1,6 мкм для траншей 300 нм 1:1
- Степень резкости 0,90 мкм для линий/промежутков 180 нм 1:1
- Степень резкости 0,80 мкм для линий/промежутков 150 нм 1:1
- Степень резкости 0,45 мкм для канала 180 нм 1:1



Скорость отжима [об/мин]

5APK 248 HM

vководство по выбору антибл	гибликовых материалов с длиной волны 248 нм				
3	Атрибуты	AR3GSF	АР10Л	AR14	AR14H
Минимальная отражательная способность	Минимум (1-й или 2-й)	1-й	1-й	1-й	1-й
	Толщина (нм)	60	60	60	60
ТРАВЛЕНИЕ	Скорость массового травления (ОТНОСИТЕЛЬНО UV6 Сопротивляться)	1.2	1.3	1.3	1.3
	Относительное травление Время (относительно ДО2/3)	1.0	1.0	1.0	1.0
Покрытие	Конформный				
	Плоская и переходная заливка				
	ЭСКАТО сопротивляется				
Сопротивляйтесь совместимости	Ацеталь/гибрид				
6000	6/13.				
	A 1				
1/2/3/3/	000	совместимый	некоторый СОВМЕСТИМЫЙ		

Разработчики

Metal Ion Free (MIF)

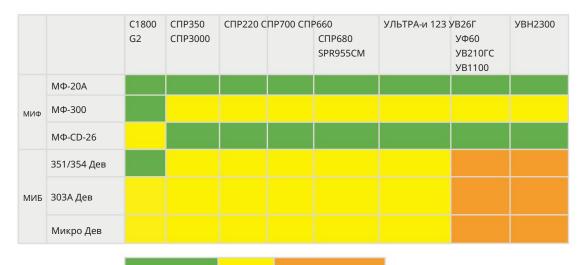
(рекомендуется там, где желательно избежать потенциального источника загрязнения ионами металлов) Серия МФ-20A – МФ-21A (0,21H), МФ-24A (0,24H), МФ-26A (0,26H)

Серия МФ-300 — МФ-319 (0,237 H), МФ-321 (0,21 H), МФ-322 (0,268 H)

Проявитель MF-CD-26 – (0,26N, без ПАВ)

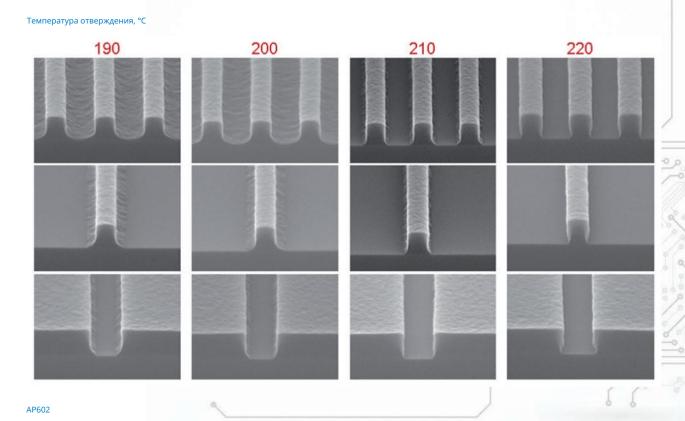
Металлический ионный подшипник (МИБ)

Microposit 354 Проявитель (0,31 H) – концентрат Microposit 351 Проявитель (1.39N) – концентрат Microposit 303A Проявитель (1.7N) – концентрат Microposit Developer (0,6N) – концентрат, наименьшее воздействие на алюминий.



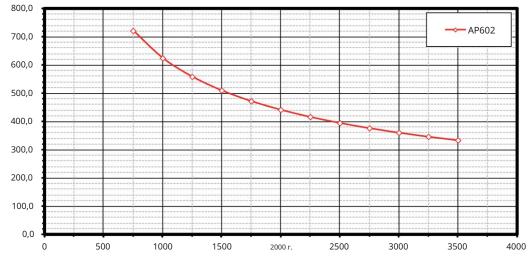
рекомендуется во<mark>зможно не рекомендуется</mark>

Скорость отвержде**мили от Теркем R602**



AR602 — это проявляющееся органическое донное антибликовое вещество, предназначенное для использования как в KrF, так и в ArF. AR602 разработан для улучшения характеристик критических слоев имплантата, минимизируя при этом негативные эффекты других имплантатов. AR602 имеет превосходный контроль отражения и улучшает профиль и CDU по сравнению с традиционным верхним антибликовым покрытием.

- Оптическая плотность при 248 нм = 7,5 мкм и при 193 = 10,4 мкм.
- Первая минимальная толщина при 520 Å на отражающих подложках.
- Скорость растворения поворотного стола в зависимости от температуры отверждения
- Разбавление продукта рассчитано на 510Å.
- Совместим со многими распространенными растворителями EBR.
- Превосходное управление компакт-диском и профилями.



10			
	Съемники кромочных бортов EBR EC-растворитель, EC-растворитель 11	на базе NMP Общий Средство для удаления резиста Purpose 1165	без NMP Общий Средство для удаления сопротивления СВЦ-14, 1112A
2 10 1 10 2	Средство для удаления полимеров из алюминия - Пакетная обработка APC-425	Средство для удаления полимеров из алюминия - Обработка одной пластины PRX-505	
00 700			

ХРОМ ТРАВИЛЬНИК 18

Chrome Etchant 18 предназначен для использования в микролитографических процессах, где требуется высокая воспроизводимость и строгий контроль размеров. Готовый к использованию раствор на основе кислых солей церия стабилен и совместим с системами положительного и отрицательного резиста.

Основное применение – изготовление масок в микроэлектронной промышленности для травления блестящих и просветляющих тонких пленок хрома на заготовках масок. Другие применения находятся в технологии тонкопленочных пленок (тонкопленочные схемы, оптические решетки, микроэлектронные устройства и т. д.) для травления пленок хрома, хромоникелевых сплавов, молибдена и вольфрама.

ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Удельная плотность при 20/20°C Цвет

Мутность Церический контент

Общая нормальность кислотности

: Прибл. 1.140: Оранжевый: Прозрачный

: Прибл. 40 г/л : Прибл. 1,90 Н





®ТМ* Торговая марка Dow Chemical Company («Dow») или дочерней компании Dow